Приведены результаты численных расчетов (рис.2) для типичных р^{*}-n-p^{*}-кремниевых ИПД с параметрами: $\mu_{,,} \equiv 450 \ cm^2/(B \ c)$, $V_{0S} \cong 9 \ 10^5 \ cm/c$. $J_{0} \equiv 10 \ A/cm^2$. $S \equiv 1.25 \ 10^{-4} \ cm^2$ $L \equiv 5 \cdot 10^{-4} \ cm$, $T \equiv 0.3 \ 10^{-10}$, $\theta_S \cong 0.186 \ \theta$, $N_S \equiv 10^{14} \ cm^{-3}$, $N_S(L) \equiv 10^{17} \ cm^{-3}$ (значению $N_s(L)$ соответствует $\alpha \equiv 1.34 \cdot 10^4 \ cm^{-1}$). Показана зависимость R_B (соответствует кривой $\alpha = 0$) от угла пролета θ (рис.2). Как видно, при наличии градиента легирующих примесей в пролетном участке ДОС по абсолютной величине увеличивается, а частотный диапазон смещается в область более низких частот.

Таким образом, с помощью выбора соответствующего профиля легирования примесей в п-области можно в ИПД структурах в определенных условиях увеличить ДОС по абсолютной величине.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арутюнян В.М., Буниатян В.В. Инжекционно-пролетные диоды / ЕГУ. -Ереван, 1986. - 226с.

2. Harutunian V.M., Buniatian V.V. The influence of capture of the injected current carriers on the characteristics if BARITT diodes // Sol. St. Electron. 1977 -V.20, No 6.-P. 491-496.

3. Арутюнян В.М., Буниатян В.В. ВЧ характеристики ИПД с неоднородно распределенной примесью в пролегной области // Тез. докл.1-й Нац. конф. "Полупроводниковая микроэлектроника", 22-23 мая, Дилижан /ЕГУ, -1997.-С.95-99.

4. Wright G.T. Small-signal characteristics of semiconductor punch-through injection and transit time diodes // Sol.St.Electron.-1973.-V.16. \mathcal{N} -8.- P.903-912. 5. Wright G.T. and Sultan N.B. Small-signal design theory and experiment for the punch-through injection transit time oscillator // Sol.St.Electron.-1973.-V.16. \mathcal{M} -4.- P.535-544.

6. Eknoyan O., Sze S.M. and Yang E.S. Microwave BARITT diode with retarding field // Sol. St. Electron.- 1977. - V.20, Met. - P.285-291.

ГИУА

13.08.1997

Изв. НАН в ГИУ Армении (сер. ТН1.) Ц. № 3, 1998, с. 366 - 371

359 681.325.6

ՌԱԴԻՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ

Ա. Ս. ՄԿՐՏՉՅԱՆ

ՖՈՐՄԱԼ ՆԵՅՐՈՆԻ ՏՏՏ ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆ

Դիտարիկեսք է ֆորմալ նեյթենի էլեկտրական սխեման, որը մուտքային և ելքային արտանություններին մակարդակներով լիովին համատեղելի է ավանդական արանգիստությաարտիզիստությին տրամաբանական (SSS) սխեմաների հետ, իր մեջ զուցակցում է SSS էսիտերակապակցված տրամաբանական (ԵԿՏ) սխեմաների առանձեահատկությունները այնանի է գոյություն ունեցող տեխնոլոգիաներով ինահզրա իրականազման համար

Рассматривается электронная схема формального нейрона, которая по входным и выходным логическим уровням полностью совместима с традиционными ТТЛ схемами, сочетая в себе достоинства ТТЛ и ЭСЛ схем, и пригодна для интегрального исполнения по существующим технологиям.

Ил. З. Табл. 1. Библиогр.: 5 назв.

A formal neuron electronic circuit completely compartible with traditional TTL on input and output logic levels combining the advantages of TTL and ECL is considered. It suils for the integrated realization by existing technologies.

1// 3. Table 1, Rol. 5.

ֆորմալ նեյրոնը (ՖՆ) բազմաֆունկցիոնալ եւ ուսուցանվող տրամաբանական էլեմենտ է, որը, ի տարբերություն սովորական շենային տրամաբանական էլեմենտի, ի վիճակի է իրականագնել տվյալ բանակությամբ (δ) տրամաբանական փոփոխականների ցանկացած տրամաբանական ֆունկցիա [1.2.3]։ Վերջին տարիներին նեյրոնային ցանցերի եւ նեյրոքունիլութերների հետ տարվող աշխատանքների ակտիվազման կապակցությամբ նեյրոնային էլեմենտների ինտեգրալ իրականազման խնդիրը խիստ արդիականացել է։

Ֆորմալ նեյրոնների ներկայումս գոյություն ունեցող էլեկտրական սխեմաները հիմնականում էմիտերակապակցված (ԷԿՏ) սխեմաներ են (4)։ Մինչդեռ այսօր ամենատարածված ինտեգրալ միկրոսխեմաները տրանգիստորա-տրանգիստորային (SSS) տրամաբանական սխեմաներն են, որոնք մուտքային եւ ելքային տրամաբանական մակարդակներով անհամատեղելի են ՖՆ-երի գոյություն ունեցող էլեկտրական սխեմաների հետ։

Ելնելով վերը ասվածից, ՖՆ-ի SSS սխեմայի մշակումը օրվա խնդիր է, սխեմա, որը ոչ միայն օժտված է SSS - էԿՏ սխեմաների դրական իատկանիշներով, այլեւ բավարարում է միկրոէլեկտրոնային տեխնոլոգիայի այսօրվա պահանջները եւ այդ իմաստով պիտանի է ինտեցրալ, իրականացման •իամար:



Նկ. 1. Երկմուտք ՖՆ-ի օրինակ

Դիտարկենք AND տեսակի ՖՆ-ի օրինակ (նկ. 1)։ Այն տարբերվում է Ոէ Մակկալլոկի NAND նեյրոնից նրանով, որ այստեղ ֆունկցիոնալ X- եւ X, մուտքերը փոխազդում են միմյանց հետ ոչ թե «արգելում», այլ «թույլատրում» ձեւով (1, 4): X₁-ը եւ X₂-ը կոչվում են ֆունկցիոնալ (տրամաբանական) մուտքեր, իսկ (x₁, (x₂, x₃, մուտքերը սինապտիկ մուտքեր։ Ընդիանուր դեպքում նեյրոնի շեմային էլեմենտի (Շէ) աշխատանքը բնութագրվում է հետեւյալ առնչությամբ.

$$\mathbf{F} = \operatorname{sign} \left\{ \sum_{i=1}^{n} \alpha_{i} \mathbf{w}_{i} - \mathbf{\theta} \right\}.$$
(1)

որտեղ w, -ն i-րդ սինապտիկ մուտքի կչիռն է (w, $\in \{0, \pm 1, \pm 2, ...\}, \theta$ - ն և նեյրոնի գրգոման չեմը ($\theta = 0, \pm 1, \pm 2, ...$)

Ընդ որում, Sign ֆունկցիան որոշվում է հետեւյալ կերպ.

$$\operatorname{Sign}(\phi) = \begin{cases} 1, \ \text{tpt} \ \phi \geq 0, \\ 0, \ \text{tpt} \ \phi < 0; \end{cases}$$
(2)

Նշանակենք

$$\sigma_{i} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_{i} w_{i}$$
(3)

եւ անվանենք գումարային գրգրում, որն ստանում է նեյրոնը, երբ նրա մուտքին գալիս է ազդանշանների որոշակի համակցություն (կոմբինացիա)։ Առաջնորդվելով այս նշանակումներով եւ ընդունելով, որ θ=0, կարելի է ասել, որ նկ.1-ում բերված նեյրոնն իրականացնում է

$$I^{2} = \overline{\mathbf{x}}_{1} \overline{\mathbf{x}}_{2}, \forall \mathbf{x}_{1} \mathbf{x}_{3}, \tag{4}$$

տրամաբանական ֆունկցիան, որը երբեմն կոչվում է «համարժեքության» կամ Վեբբի ֆունկցիա (5)։ Դժվար չէ նկատել, որ վերջինս հանրահայտ «մոդուլ 2-ով գումարում» կամ «անհամարժեբություն» ֆունկցիայի բացասումն է։ Այսինքն

$$F = x_1 \overline{x}_2 \lor \overline{x}_1 x_3$$

Եշենք նաեւ որ (4) ֆունկցիան F=x,x,x,...,x ∨x₁x₂x,....,x_n ֆունկցիայի մասնավոր դեպքն է ֆունկցիա, որը լայն կիրառություն ունի պատկերների ճանաչման խնդիրներում, մասնավորապես պատկերի նգրագիծը գտնելու համար.

Այժմ դիտարկենք նկ. 1-ում բերված երկմուտք նեյրոնի առաջարկվող SSS սխեման (նկ. 2)։ Սխեմայի հիմքում ընկած է երկկասկադ էԿՏ սխեման, որը մանրամասն նկարագրված է գրականության մեջ [4]։ Տարբերությունն այն է, որ սխեմայի մուտքային եւ ելքային կասկադները կառուցված են այնպես, որ այն, առանց միջանկյալ համաձայնեցնող շղթաների, կարող է աշխատել SSS սխեմաների հաջորդական շղթայում (նկ.3)։



ւ եկ, 3 - Ֆե-ի տեղը սխեմաների հաջորդական շղթայում

Ինչպես երեւում է նկ.2-ի սխեմայից, երկկասկադ էԿՏ սխեմայի կմախքը պահպանված է [4], այսինքն նեյրոնի սինապտիկ մուտքերն իրականացված են հոսանքի փոխանջատիչներով (ՅՓ), որոնց ելքերում դրական եւ բացասական հոսանքները գումարվում են, իսկ դրանց (\mathbf{I}_{M} եւ \mathbf{I}_{N}) համեմատուծը տեղի է ունենում ելքային դիֆերենցիալ ուժեղարարի միջոցով, որի ելքերում նորից դրված են էմիտերային կրկնիչներ։ Սխեմայի ելքում միացված են SSS սխեմայի ելքային կասկադները հաջորդական Q₃ եւ Q₄ տրանզիստորներով (նկ.2), սակայն միացումները կատարված են այնպես, որպեսզի ելքում ապահովվեն անհրաժեշտ տրամաբանական մակարդակները, $U^{0} \le +0.3 -4$, $U^{1} \ge +3,6 -4$. Բացի դրանից, ելքային կասկադը պարունակում է նաեւ հատուկ շղթա (Q₅, Q₅), որն ապահովում է Q₄ տրանզիստորի պաշտպանությունը գերբեռնվածության հոսանքից երբ տեղի է ունենում ելքի կարճ միացում +5Վ սնման գծալարի հետ (նկ.2):

ՖՆ-ի կեկտրական սխեմայի (նկ.2) հաշվարկի համար առաջնորդվում ենք ՖՆ-ի կառուցվածքային (նկ.1) սխեմայով եւ (1)...(4) ֆունկցիոնալ առնչություններով։ Դրանց հիման վրա նախ կազմում ենք նեյրոնի ճիշտ աշխատանքի (ճշմարտության) աղյուսակը.

Աղյուսակ						
x 1	X <u>2</u>	$x_1 \ll x_2$	$\sum_{i=1}^{i} \alpha_i w_i$	1-	Պայմանը	
α_{1}	α,	Cl.			UM. UN	IM. IN
0	0	0	0	1	$U_{\rm M} < U_{\rm N}$	$ I_{\rm bi} > I_{\rm N}$
0	1	0	-1	0	U _M >U _N	$l_{\rm M}\!<\!l_{\rm N}$
1	0	0	-1	0	$U_{\rm N}{\!$	$I_{\rm M}\!<\!I_{\rm N}$
1	1	1	0	1	$U_M{<}U_N$	$I_M > I_N$

Ելնելոս Էլեկտրական սխեմայից, կարող ենք գրել

 $U_M = E - I_M R_M$, $U_N = E - I_N R_N$;

(5)

Աղյուսակի առաջին տողից հետեւում է, որ, անկախ I_M -ի եւ I_N-ի արժեքներից, Ելման վիճակում (X₁=X₂=0)- պետք է բավարարվի F=1 պայմանը։ Դետեւաբար Raise Rais

Դիֆերենցիալ ուժեռարարի նորմալ փոխանջատման համար բավարար է, որ M եւ N կետերի պոտենցիալները տարբերվեն իրարից գոնե $\Delta U = 0.3...0.44$ -ով Սկսեմայից երեւում է, որ եթե $I_{\rm M}$, $I_{\rm N}$ հոսանքների մեծ տարբերության պատճառով ΔU ավելի մեծ լինի, քան 0.7 4, ապա կքացվի դ, կամ դ, դիոդը, եւ տեղի կունենա $I_{\rm M}$ եւ $I_{\rm N}$ հոսանքների վերաբաշխում։ Այսինքն, առաջարկվող սխեմայում միշտ $\Delta U = [U_{\rm M} - U_{\rm N}] \le 0.7$ 4.

ելնելով էլեկտրական սխենայից (նկ.2), եւ առաջնորդվելով ադ.1-ով. կարող ենք կազմել 4 անհավասարություններից բաղկացած մի համակարգ, որոնց մեջ մտնում են R. R. R. եւ R. ռեզիստորների փնտրվող արժեքները. Լուծելով անհավասարությունների համակարգը, կարող ենք որոշել այդ ռեզիստորների արժեքները: Սխեմայի մյուս շղթաների ռեզիստորների մեծությունները սկզբունքային նշանակություն չունեն նեյրոնի ճիշտ աշխատանքի համար։ Այդ պատճառով այդ ռեզիստորների մեծությունները կվերցնենք նույնը ինչ որ դասական SSS և։ ԵԿՏ սխեմաներինը որպեսզի տրանզիստորների աշխատանքային ռեժիմները չփոխվեն։ Նկ.2-ում ռեզիստորների կողքին գրված են նրանց մոտավոր հաշվարկային առժեքները։ Սնհրաժեշտության դեպքում կարելի է կատարել ավելի ճշգրիտ հաշվարկ

370

ելնելով տրանզիստորների պարածետրերից։ Օգտագործելով ժամանակակից քոծփյութերների հնարավորությունները, կարելի է ո – θ պարածետրական տարածության մեջ որոշել նաեւ սխեծայի կայուն աշխատանքային կետը :

Այսպիսով, առաջարկվող սխեման զուգակցում է SSS սխեմաների արժանիքները, բարձր խանգառապաշտպանվածությունը մուտքից, ազդանշանի մեծ ամպլիտուղը եւ էԿS սխեմաների արագագործությունը (ՅՓ ների տրանզիստորների աշխատանքի ակտիվ ռեժիմի շնորհիվ). Քանի որ առաջարկվող սխեմայում բացակայում են ռեակտիվ տարրեր, օգտագործվող բաղադրատարրերի (տրանզիստորներ, դիոդներ, ռեզիստորներ) տեխնոլոգրական թույլատրվածքները կարող են հասնել մինչեւ 10%, եւ այդ տիրույթում սխեման դեռեւս անսխալ կատարում է պահանջվող ֆունկցիան (4), ապա կարելի է ասել, առաջարկվող սխեման պիտանի է ինտեզրալ տեխնոլոգիայով իրականացման համար։

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Мкртчян С.О. Нейроны и нейронные сети. – М. Энергия, 1971. – 232 с. 2. Дертоузос М. Пороговая логика.- М. Мир. 1967. - 343 с.

3 Маккаллок У. Символическое изображение нейрона в виде некоторой логической функции // Принципы самоорганизации: Сб. / Пер. с английского; Под ред. А.Я. Лернера. - М.: Мир. 1966. - 621 с.

4. Мкртчян С.О. Проектирование логических устройств ЭВМ на нейрозных элементах - М. Энергия, 1977. - 200 с.

5. Послелов Д.А. Логические методы анализа и синтеза сжем. М... Энергия. 1964 - 320 с.

ГИУА

14.01.1997

Пая. НАП в ГИУ Армении (сер. ТН), т. LL & 5, 1998, с. 371 - 374.

УДК 621.349 74

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

В.Е. АРУСТАМЯН, Х.А. МАЗХАР

ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ОПТИМИЗАЦИИ ЦИФРОВОГО КАНАЛА

յնություն ցեռաթառանան մետերերություն ուղերացում հիայիս է Նեռիթիսը։ Նախերանություն վլաճչյու եկաղությունը կոնակոն մանձգություցի ուղերակում վլատաստում անտարարություն

Рассматриваются возможность оптимизации цифрового канала путем минимизации суммарного значения времени передачи и затрат на реализацию канала.

Ил 2. Библиогр.: З назв.